日本計量新報

計測と科学

NMIJ高精度ナノ計測技術に関するシンポジウム

2月21日（水）、お台場の東京国際交流館メディアホールで

高精度・高信頼性計測技術の研究開発の現状と展望

㈱産業技術総合研究所計測標準研究部門は「ナノ応用製造に必要な高精度ナノ計測技術に関するシンポジウム（Symposium on "High-Precision Nano-Metrology for Nano-Manufacturing"）」を、2月21日㈬、お台場の東京国際交流館メディアホールで開催する。ナノ応用製造に必要な高精度・高信頼性計測技術の研究開発の現状と今後の展望をさぐる。参加募集は先着100名。

モノ作りの微細化技術が急速に進展し、ナノテクノロジーを応用した材料・デバイスは開発競争が世界的に激化している。世界市場で競争力を確実にするためには、計量標準を基にした再現性、信頼性のある計測技術開発が必要であり、今回はナノ応用製造に必要な高精度・高信頼性計測技術の現状と今後を展望する。講演と18件のポスターセッションを予定している。共催はNEDO（新エネルギー・産業技術総合開発機構）。NMIJ計測クラブが協賛する。

【日時】2月21日㈬、10時～17時30分

【場所】東京国際交流館メディアホール（お台場、東京都江東区青海2－79、新交通ゆりかもめ「船の科学館」東口から徒歩約3分）

【参加費】無料

【募集人員】先着100名

【使用言語】英語／日本語（同時通訳付）

【申込方法】webサイトから（http://www.nmii.jp/cgi-bin/svmpo/svmpo070221moshikomi.html）

【プログラム】▽開会挨拶＝西本光徳（経済産業省）▽ITIanssen（英国NPL）＝「NPLにおけるナノ計測技術とナノサイエンス」▽Haral d Bosse（独国PTB）＝「PTBにおけるナノ製造を視野に入れたナノ計測技術の開発状況」▽Tan Siew Leng（SPRING.Singapol）＝「SPRINGにおけるナノ計測技術の開発状況」（仮）▽久保田弘（熊本大学）＝「半導体量産地域における超精密計測技術と標準への期待」▽森田瑞穂（大阪大学）＝「S・i－S・iO_2構造を持つナノデバイスにおけるナノ計測技術」▽稲田博実（日立ハイテクノロジーズ）＝「走査透過電子顕微鏡（STEM）による半導体デバイスの薄膜評価・計測技術」▽谷口佳代子（ソニーマニュファクチュアリングシステムズ）（予定）▽小島勇夫（産総研）＝「NMIJにおけるナノ計測技術の開発状況」▽閉会挨拶

上皇デジタル秤はかり
5,000円台
TANITA
2025,KTSE-1000

NITE JCSS長さ「表面性状」の説明会

2月19日、つくばの産総研で

㈱製品評価技術基盤機構認定センターは、JCSS（校正事業者認定制度）の長さ区分における「表面性状」の技術的要求事項適用指針を制定するにあたり、説明会を、2月19日、茨城県つくば市の産業技術総合研究所で開催する。出席希望者は、申込書で2月9日までにFAXで申し込む。

【日時】2月19日㈪、14時～15時

【場所】㈱産業技術総合研究所国際計量標準センター（3－9）3階大会議室（茨城県つくば市梅園1－1－1、中央第3）

【内容】JCSS長さ「表面性状」の技術的要求事項適用指針の制定について

【問い合わせ先】㈱製品評価技術基盤機構認定センター中部認定事務所（藤井・洞口）＝〒460－0001、名古屋市中区三の丸2－5－1、☎052－951－1932、FAX052－951－3902、http://www.nite.go.jp/ase/icss/index.html

㈳日本計量機器工業連合会

「間近に迫った中国版RoHS」に係わるセミナー

2月26日、グランドヒル市ヶ谷で

㈳日本計量機器工業連合会は、現地で入手した中国版RoHS規制の最新動向を会員企業に周知するため、セミナーを開催する。

中国では、「中国電子情報製品汚染制御管理方法（中国版RoHS規制）」を、2007年3月1日から施行することとしている。

この規制が施行されると計量計測機器を含むほとんどの電気・電子機器が規制の対象となり、中国市場における会員企業の活動にも大きな影響が出るものと懸念される。

このため、㈳日本計量機器工業連合会では、中国版RoHS規制に係わる最新情報を収集するため、2007年1月28日～2月3日まで中国へ調査団を派遣し、中国国家質量監督検験検疫総局、国家情報産業部等の関係政府機関、JEITA（㈳電子情報技術産業協会）北京事務所及び現地企業を訪問し、規制の内容、規制方法、規制への取り組み実態、分析現場の視察などを行い、現況を把握することとしている。

【日時】平成19年2月26日㈪、14時～16時

【会場】グランドヒル市ヶ谷　東京都新宿区市谷本村町4－1、☎03－3268－0111、会場案内図http://www.ghi.gr.jp/access/index.html

【テーマ】間近に迫った中国版RoHS規制－計工連現地調査による最新情報－

【講師】㈱島津製作所地球環境管理室環境カウンセラーCEAR登録環境審査員川口重一氏

【参加費】▽会員5、000円▽団体会員の会員8、000円▽会員外10、000円（消費税を含む）※当日会場にて支払い

【定員】100名（先着順にて受付・定員に達し次第締切）

【申込締切】2月20日㈫

【申込先】㈳日本計量機器工業連合会〒162－0837、東京都新宿区納戸町25－1、☎03－3268－2121、FAX03－3268－2167、Eメール：horii@keikoren.or.jp／shigemori@keikoren.or.jp　担当：堀井・重森

新年特集号第5集

Yamato
清潔な環境を創造する
完全防水型デジタル上皿自動はかり
●全面・底面等電位：PS8準拠
●オールステンレスボディー
●品質入力機能付きセパ・ラベル設計
UDS－1VⅡ/N－WP
大和製衡株式会社
電話 (078) 618－5577

今週の主な記事

NMIJ高精度ナノ計測技術に関するシンポジウムほか　①面
団体新年会　②面
計工連、計量測定協力セミナー参加者募集ほか　③面
計量制度見直し座談会　④面
あいち座談会　⑤面
計量ひとくちメモ、社説　⑦面
計量展2007、新製品・プラテック、新光電子、山佐時計器　⑧面